

# 橢圓偏光儀-Woollam

Spectroscopic Ellipsometer

Model : Woollam M-2000VI

## 一、測試目的：

橢圓偏光術是一種非接觸式、非破壞性、以光學技術量測薄膜表面特性的方法。

## 二、樣品準備須知及注意事項：

- 1.樣品需有反射面。
- 2.若 substrate 底部有被反射，可黏貼 3M 隱形貼紙或拋霧以解決被反射問題。

## 三、限制：

固相薄膜樣品。

## 四、使用方法：

- 1.系內使用以登記申請，由專責技術員指導自行分析為原則。
- 2.系外單位使用，須經登記申請，並經系主任及負責老師同意後，始可測試。

## 五、負責老師：洪儒生